

# XF-PTL12282-M95-12-VI

## 主要参数

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 光学结构  | 双远心                             |
| 倍率    | 0.708                           |
| 物方视野  | $\Phi 115.8\text{mm}$           |
| 像方视野  | $\Phi 82\text{mm}$              |
| 工作距离  | $260\text{mm} \pm 3\%$          |
| 远心度   | $<0.04^\circ (0.06^\circ)$      |
| 景深    | $2.7\text{mm} @ F13.5$          |
| 光圈    | F8-F111.0                       |
| 分辨力   | $12.6\mu\text{m} @ F13.5$       |
| 像方MTF | $>0.3 @ 75\text{lp/mm} @ F13.5$ |
| 光学畸变  | $<0.035\% (0.063\%)$            |

## 测量范围

|        |                             |                             |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 35film | $36 \times 24$              | $50.8 \times 33.9\text{mm}$ |
| 2'     | $23 \times 23$              | $32.5 \times 32.5\text{mm}$ |
| 4/3'   | $18 \times 13.5$            | $25.4 \times 19.1\text{mm}$ |
| 1.1'   | $14.2 \times 10.4$          | $20.1 \times 14.7\text{mm}$ |
| 4K线扫描  | $4096 \times 7\mu\text{m}$  | $40.5\text{mm}$             |
| 8K线扫描  | $8192 \times 5\mu\text{m}$  | $57.9\text{mm}$             |
| 8K线扫描  | $8192 \times 7\mu\text{m}$  | $81.0\text{mm}$             |
| 16K线扫描 | $16384 \times 5\mu\text{m}$ | $115.7\text{mm}$            |

